

超音波顕微鏡

材料のクラック・ボイドの画像化

[型式]

(株)日本レーザー SAMTEC EVOLUTION I

[仕様]

スキャンモード: A,B,C,D

測定範囲: 最大10×10cm

測定周波数: 3.5,10,100MHz

[設置年度]

2010年度(平成22年度)

